

Исследовательский вертикальный металлургический микроскоп

BS-6024



BS-6024TRF

Описание

Металлургические микроскопы серии BS-6024 были разработаны для исследований с рядом инновационных конструкций по внешнему виду и функциям, с широким полем зрения, высокой четкостью и полуапохроматическими металлургическими объективами со светлым/темным полем и эргономичной операционной системой. Созданы для того, чтобы обеспечить идеальное исследовательское решение.

Особенности

1. Бесконечная оптическая система.

Благодаря превосходной бесконечной оптической системе вертикальный металлургический микроскоп серии BS-6024 обеспечивает изображения с высоким разрешением, высокой четкостью и исправленными

хроматическими aberrациями, которые могут очень хорошо отображать детали образца.

2. Модульная конструкция.

BS-6024 имеют модульную конструкцию для различных применений в промышленности и материаловедении. Это дает пользователям гибкость для создания системы для конкретных нужд.

3. Функция ЭКО.

Освещение микроскопа автоматически выключится через 15 минут после ухода оператора. Это не только экономит энергию, но и продлевает срок службы лампы.



4. Удобный и простой в использовании.



(1) Объективы NIS45 Infinite Plan Semi-APO and APO.

Объективы могут точно воспроизводить естественный цвет благодаря тщательно подобранному высокопрозрачному стеклу и передовым технологиям нанесения покрытий. Доступны различные объективы, включая поляризационные и с большим рабочим расстоянием.



(2) Nomarski DIC.

Благодаря новому дисковому модулю перепад высот образца, который невозможно определить при ярком освещении, превращается в рельефное или трехмерное изображение. Он идеально подходит для наблюдения за проводящими частицами ЖК-дисплея, царапинами на поверхности жесткого диска и т.д.



(3) Система фокусировки.

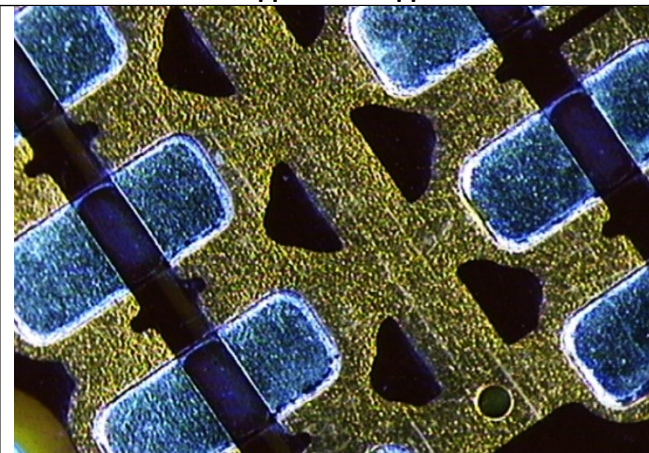
Чтобы сделать систему подходящей для работы операторов, ручку фокусировки и ступени можно отрегулировать в левостороннем или правостороннем положении. Такая конструкция делает эксплуатацию более комфортной.



(4) Наклон тринокулярной головки.

Окулярный тубус может регулироваться от 0° до 35°, Тринокулярная может быть подключена к зеркальной и цифровой фотокамере с 3-позиционным разделителем луча. (0:100, 100:0, 80:20), разделительная планка может быть собрана с любой стороны в соответствии с требованиями пользователя.

5. Различные методы наблюдения.



Темное поле (Вафля)

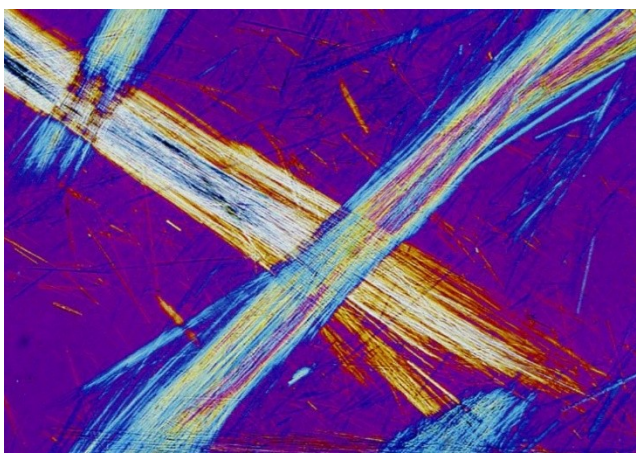
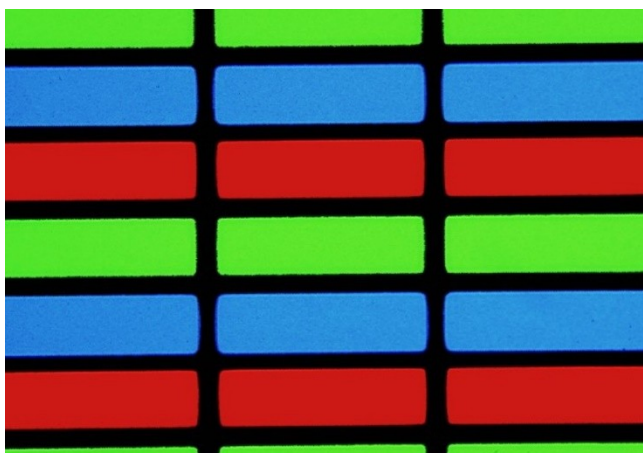
Темное поле позволяет наблюдать рассеянный или дифрагированный свет от образца. Все, что не плоское, отражает этот свет, в то время как все, что плоское, кажется темным, поэтому недостатки четко выделяются. Пользователь может определить наличие даже мельчайшей царапины или дефекта размером до 8 нм, что меньше предела разрешающей способности оптического микроскопа. Темное поле идеально подходит для обнаружения мельчайших царапин или дефектов на образце и исследования образцов с зеркальной



Дифференциальный интерференционный контраст (проводящие частицы)

ДИК — это микроскопический метод наблюдения, при котором разница высот образца, не обнаруживаемая в светлом поле, становится рельефным или трехмерным изображением с улучшенным контрастом. В этом методе используется поляризованный свет, и его можно настроить с помощью трех специально разработанных призм. Идеально подходит для исследования образцов с очень незначительной разницей в высоте, включая металлургические

поверхностью, включая пластины.	структуры, минералы, магнитные головки, жесткие диски и поверхности полированных пластин.
---------------------------------	---



Наблюдение за проходящим светом (LCD)
Для прозрачных образцов, таких как ЖК-дисплеи, пластмассы и стеклянные материалы, возможно наблюдение в проходящем свете с использованием различных конденсоров. Исследование образца в проходящем светлом поле и поляризованном свете может выполняться в одной удобной системе.

Поляризованный свет (асбест)
Этот микроскопический метод наблюдения использует поляризованный свет, генерируемый набором фильтров (анализатор и поляризатор). Характеристики образца напрямую влияют на интенсивность света, отраженного через систему. Подходит для металлургических структур (т. е. структуры роста графита на чугуне с шаровидным графитом), минералов, ЖК-дисплеев и полупроводниковых материалов.

Применение

Микроскопы серии BS-6024 широко используются в институтах и лабораториях для наблюдения и определения структуры различных металлов и сплавов, а также могут использоваться в электронной, химической и полупроводниковой промышленности, такой как пластины, керамика, интегральные схемы, электронные микросхемы, печатные устройства, печатные платы, ЖК-панели, пленка, порошок, тонер, проволока, волокна, гальванические покрытия и другие неметаллические материалы.

Технические характеристики

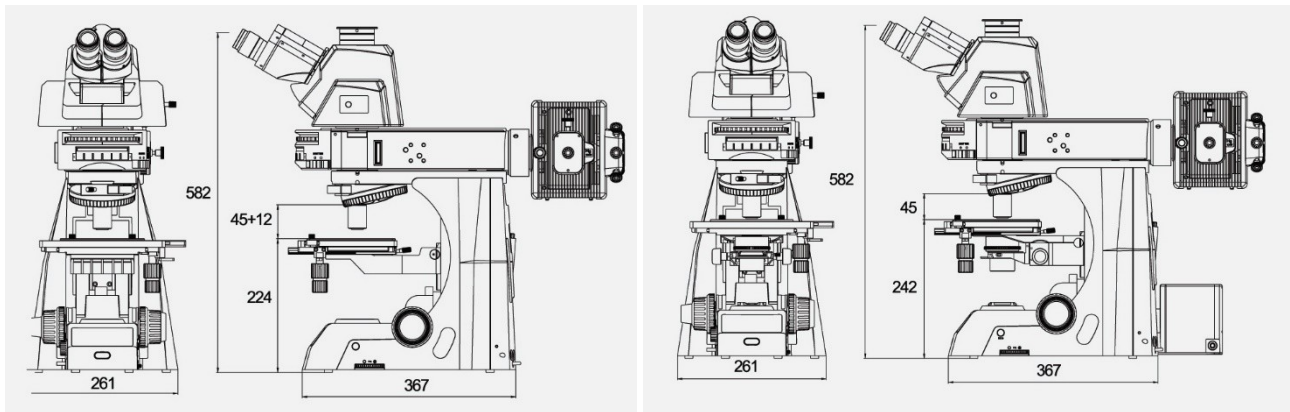
Название	Спецификация	BS-6024RF	BS-6024TRF
Оптическая система	Оптическая система с бесконечной цветокоррекцией NIS 45 (длина трубки: 200 мм)	•	•
Смотровая головка	Эргономичная тринокулярная головка с наклоном, регулируемая по наклону 0–35°, межзрачковое расстояние 47–78 мм; Коэффициент	•	•

	разделения Окуляр: Тринокуляр = 100:0 или 20:80 или 0:100			
	Тринокулярная насадка Seidentopf, угол наклона 30°, межзрачковое расстояние: 47–78 мм; Коэффициент разделения Окуляр: Тринокуляр = 100:0 или 20:80 или 0:100	○	○	
	Бинокулярная насадка Seidentopf, угол наклона 30°, межзрачковое расстояние: 47–78 мм	○	○	
Окуляр	Сверхширокоугольный окуляр SW10X/25 мм с регулируемой диоптрией	●	●	
	Сверхширокоугольный окуляр SW10X/22 мм с регулируемой диоптрией	○	○	
	Сверхширокоугольный окуляр EW12,5X/16 мм с регулируемой диоптрией	○	○	
	Широкоугольный окуляр WF15X/16 мм с регулируемой диоптрией	○	○	
	Широкоугольный окуляр WF20X/12 мм с регулируемой диоптрией	○	○	
Объектив	NIS45 Infinite LWD Plan Semi-APO (BF и DF)	5X/NA=0,15, WD =20 мм	●	●
		10X/NA=0,3, WD =11 мм	●	●
		20X/NA=0,45, WD =3,0 мм	●	●
	NIS45 Infinite LWD Plan APO (BF и DF)	50X/NA=0,8, WD =1,0 мм	●	●
		100X/NA=0,9, WD =1,0 мм	●	●
	NIS60 Infinite LWD Plan Semi-APO (BF)	5X/NA=0,15, WD =20 мм	○	○
		10X/NA=0,3, WD =11 мм	○	○
		20X/NA=0,45, WD =3,0 мм	○	○
NIS60 Infinite LWD Plan APO (BF)	50X/NA=0,8, WD =1,0 мм	○	○	
	100X/NA=0,9, WD =1,0 мм	○	○	
Наконечник	Шестикратная револьверная головка заднего хода (DIC)	●	●	
Конденсор	Конденсор LWD NA0,65	○	●	
Проходящее освещение	Галогенная лампа 24В/100Вт, подсветка Kohler, с фильтром ND6/ND25	○	●	
	Лампа S-LED мощностью 3 Вт, предустановленная по центру, регулируемая интенсивность	○	○	
Отраженное освещение	Галогенная лампа отраженного света 24 В/100 Вт, подсветка Келера, с 6-позиционной револьверной головкой	●	●	
	Галогенная лампа 100Вт	●	●	
	Отраженный свет со светодиодной лампой 5 Вт, освещение Kohler, с 6-позиционной револьверной головкой	○	○	
	Модуль светлого поля BF1	○	○	
	Модуль светлого поля BF2	●	●	
	Модуль темного поля DF	●	●	
	Встроенный фильтр ND6, ND25 и фильтр цветокоррекции	○	○	
ЭКО-функция	Функция ECO с кнопкой ECO	●	●	
Фокусировка	Низкопозиционная коаксиальная грубая и точная фокусировка, точное деление 1 мкм, диапазон перемещения 35 мм	●	●	
Макс. высота образца	76 мм	●		
	56 мм		●	

Предметный столик	Двухслойный механический столик размером 210 мм x 170 мм; диапазон перемещения 105 мм x 105 мм (правая или левая ручка); точность: 1 мм; с твердой оксидированной поверхностью для предотвращения истирания, направление Y может быть заблокировано	●	●
	Держатель может использоваться для удержания пластин размером 2", 3", 4"	○	○
Комплект DIC	Комплект DIC для отраженного освещения (для объективов с увеличением 10X, 20X, 50X, 100X)	○	○
Поляризационный комплект	Поляризатор для отраженного освещения	○	○
	Анализатор отраженного освещения, поворотный на 0-360 °	○	○
	Поляризатор для проходящего освещения		○
	Анализатор проходящего освещения		○
Другие аксессуары	0,5X C-образный адаптер	○	○
	1X C-образный адаптер	○	○
	Пылезащитный чехол	●	●
	Шнур питания	●	●
	Калибровочный слайд 0,01 мм	○	○
	Прижимное устройство для образцов	○	○

Примечание: ● Стандарт; ○ Опция

Размеры



BS-6024RF BS-6024TRF

Единица: мм

Схема системы

